



# 中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 629—2014

## 附录 C

### 检定用标准物质的标准衍射角

#### C.1 粉末 $\alpha$ -SiO<sub>2</sub> 标准物质的标准衍射角

在使用 CuK<sub>α</sub> 辐射时，粉末  $\alpha$ -SiO<sub>2</sub> 标准物质各晶面对应的衍射角如表 C.1 所列。

表 C.1 检定中  $\alpha$ -SiO<sub>2</sub> 标准物质各晶面对应的衍射角

| 晶面    | 衍射角/(°) |
|-------|---------|
| (100) | 20.860  |
| (101) | 26.639  |
| (110) | 36.543  |
| (200) | 42.449  |
| (211) | 59.958  |
| (312) | 90.828  |
| (321) | 106.589 |
| (314) | 120.119 |

#### C.2 粉末 Si 标准物质的衍射角

在使用 CuK<sub>α</sub> 辐射时，Si (111) 晶面对应的  $2\theta$  角为 28.442°。

上述数据来自国际衍射数据中心 (The International Center for Diffraction Data, 简称 ICDD)。如果权威机构对此进行更新，则应以最新数据为准。

## 多晶 X 射线衍射仪

Polycrystalline X-Ray Diffractometers



JJG 629-2014

版权专有 侵权必究

\*

书号:155026·J-2931

定价: 21.00 元

2014-06-15 发布

2014-12-15 实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

## B.3 检定结果通知书检定结果页式样

证书编号××××××—××××

## 检定结果

| 检定项目                          | 技术要求 | 检定结果 | 结论 |
|-------------------------------|------|------|----|
| 1. 外观                         |      |      |    |
| 2. 仪器 $2\theta$ 角示值误差/(°)     |      |      |    |
| 3. 仪器 $2\theta$ 角重复性/(°)      |      |      |    |
| 4. 仪器分辨力/%                    |      |      |    |
| 5. 探测器能谱分辨力/(%)               |      |      |    |
| 正比计数器                         |      |      |    |
| 闪烁计数器                         |      |      |    |
| 6. 衍射强度稳定性/(%)                |      |      |    |
| 7. 绝缘电阻/M $\Omega$            |      |      |    |
| 8. 绝缘强度                       |      |      |    |
| 9. 泄漏电流/mA                    |      |      |    |
| 10. 散漏射线空气比释动能率/( $\mu$ Gy/h) |      |      |    |

不合格项目:

第×页 共×页

中华人民共和国  
国家计量检定规程  
多晶 X 射线衍射仪

JJG 629—2014

国家质量监督检验检疫总局发布

\*

中国质检出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)  
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 28 千字  
2014 年 9 月第一版 2014 年 9 月第一次印刷

\*

书号: 155026·J-2931 定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107

## B.2 检定证书检定结果页式样

证书编号×××××—××××

## 检定结果

| 检定项目                                | 技术要求 | 检定结果 | 结论 |
|-------------------------------------|------|------|----|
| 1. 外观                               |      |      |    |
| 2. 仪器 $2\theta$ 角示值误差/ $^{\circ}$   |      |      |    |
| 3. 仪器 $2\theta$ 角重复性/ $^{\circ}$    |      |      |    |
| 4. 仪器分辨力/ $\%$                      |      |      |    |
| 5. 探测器能谱分辨力/ $\%$                   |      |      |    |
| 正比计数器                               |      |      |    |
| 闪烁计数器                               |      |      |    |
| 6. 衍射强度稳定性/ $\%$                    |      |      |    |
| 7. 绝缘电阻/M $\Omega$                  |      |      |    |
| 8. 绝缘强度                             |      |      |    |
| 9. 泄漏电流/mA                          |      |      |    |
| 10. 散漏射线空气比释动能率/ $(\mu\text{Gy/h})$ |      |      |    |

第×页 共×页

## 多晶 X 射线衍射仪

## 检定规程

Verification Regulation for  
Polycrystalline X-Ray Diffractometers

JJG 629—2014  
代替 JJG 629—1989

归口单位：全国环境化学计量技术委员会

主要起草单位：上海市计量测试技术研究院

参加起草单位：丹东市计量测试技术研究所

本规程委托全国环境化学计量技术委员会负责解释